

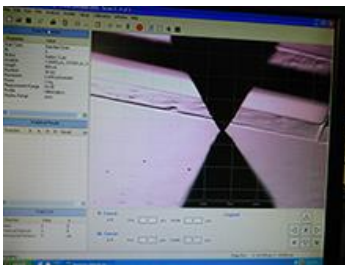
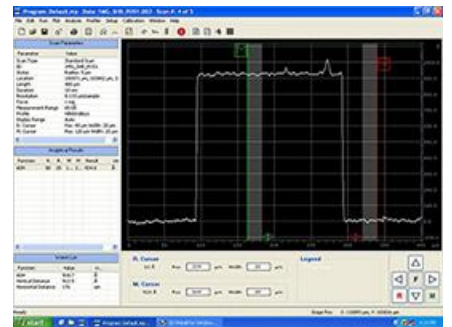
# 評価

## 触針式表面形状測定器

アルバック社製 Dektak8

### 仕様

垂直分解能/レンジ	1 Å / 65k Å 10 Å / 655k Å 40 Å / 2620 Å
サンプルサイズ	直径210mm
測定長さ	50μ m ~ 50mm
最大サンプリング数	30,000 点
測定加重	1 ~ 15mg
自動多点測定数	最高200点
サンプル観察	トップビュー(低倍率カラー) 10mm サイドビュー(高倍率カラー) 1mm



### 触針式段差測定

本装置では、ダイヤモンド触針の下で、精密な基準表面上をサンプルステージを直線的に移動させることにより、直径200mm以下の基板上に形成された、試料表面の段差、うねり、粗さなどの表面形状を高精度に測定することができます。

試料表面の形状変化を差動トランスにより検出し、信号を積分型のA-Dコンバータによってアナログからデジタルに変換してコンピュータのメモリに保存します。水平調整・拡大等のデータ処理を行った後、表面形状のプロファイル、表面粗さなどの解析パラメータとして表示できます。

「文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業」

微細加工プラットフォーム ・ 香川大学



お問い合わせ先

香川大学 産学連携・知的財産センター  
ナノテクノロジー支援室

TEL/FAX: 087-887-1873

E-mail: nanoplatform-c@kagawa-u.ac.jp